

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Electrical equipment for measurement, control and laboratory use –
EMC requirements –
Part 1: General requirements**

**Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire –
Exigences relatives à la CEM –
Partie 1: Exigences générales**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 17.220.20; 25.040.40; 33.100.20

ISBN 978-2-8322-8947-1

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD	4
INTRODUCTION	6
1 Scope	7
2 Normative references	8
3 Terms, definitions and abbreviations	9
3.1 Terms and definitions	9
3.2 Abbreviations	12
4 General	12
5 EMC test plan	12
5.1 General	12
5.2 Configuration of EUT during testing	13
5.2.1 General	13
5.2.2 Composition of EUT	13
5.2.3 Assembly of EUT	13
5.2.4 I/O PORTS	13
5.2.5 AUXILIARY EQUIPMENT	13
5.2.6 Cabling and earthing (grounding)	13
5.3 Operation conditions of EUT during testing	13
5.3.1 Operation modes	13
5.3.2 Environmental conditions	14
5.3.3 EUT software during test	14
5.4 Specification of FUNCTIONAL PERFORMANCE	14
5.5 Test description	14
6 Immunity requirements	14
6.1 Conditions during the tests	14
6.2 Immunity test requirements	14
6.3 Random aspects	17
6.4 Performance criteria	18
6.4.1 General	18
6.4.2 Performance criterion A	18
6.4.3 Performance criterion B	18
6.4.4 Performance criterion C	18
7 Emission requirements	19
7.1 Conditions during measurements	19
7.2 Emission limits	19
8 Test results and test report	19
9 Instructions for use	20
Annex A (normative) Immunity test requirements for PORTABLE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT powered by battery or from the circuit being measured	21
Annex B (informative) Guide for analysis and assessment for electromagnetic compatibility	22
B.1 General	22
B.2 Risk analysis	22
B.3 Risk assessment	22
Bibliography	24

Figure 1 – Examples of ports	11
Table 1 – Immunity test requirements for equipment intended to be used in a BASIC ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT	15
Table 2 – Immunity test requirements for equipment intended to be used in an INDUSTRIAL ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT	16
Table 3 – Immunity test requirements for equipment intended to be used in a CONTROLLED ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT	17
Table A.1 – Immunity test requirements for PORTABLE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT	21

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL AND LABORATORY USE – EMC REQUIREMENTS –

Part 1: General requirements

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61326-1 has been prepared by subcommittee 65A: System aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

This third edition cancels and replaces the second edition, published in 2012. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- the immunity test levels and performance criteria have been reviewed;
- requirements for portable test and measurement equipment have been clarified and amended;

- the description of the electromagnetic environments has been improved.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
65A/975/FDIS	65A/985/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

In this document, the following print types are used:

- Terms used throughout this document which have been defined in Clause 3: SMALL CAPITALS

A list of all parts of the IEC 61326 series under the general title *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

Instruments and equipment within the scope of this document may often be geographically widespread and hence operate under a wide range of environmental conditions.

The limitation of undesired electromagnetic emissions ensures that no other equipment installed nearby is unduly influenced by the equipment under consideration. The limits are more or less specified by, and therefore taken from, IEC and International Special Committee on Radio Interference (CISPR) publications.

However, the equipment should function without undue degradation in an electromagnetic environment typical for the locations where it is intended to be operated. In this respect, the document specifies three different types of electromagnetic environment and the levels for immunity. More detailed information about issues related to electromagnetic environments are given in IEC TR 61000-2-5. Special risks, involving for example nearby or direct lightning strikes, circuit-breaking, or exceptionally high electromagnetic radiation in close proximity, are not covered.

Complex electric and/or electronic systems should require EMC planning in all phases of their design and installation, taking into consideration the electromagnetic environment, any special requirements, and the severity of failures.

This part of IEC 61326 specifies the EMC requirements that are generally applicable to all equipment within its scope. For certain types of equipment, these requirements will be supplemented or modified by the special requirements of one, or more than one, particular part IEC 61326-2 (all parts). These should be read in conjunction with the IEC 61326-1 requirements.

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL AND LABORATORY USE – EMC REQUIREMENTS –

Part 1: General requirements

1 Scope

This part of IEC 61326 specifies requirements for immunity and emissions regarding electromagnetic compatibility (EMC) for electrical equipment, operating from a supply or battery of less than 1 000 V AC or 1 500 V DC or from the circuit being measured. Equipment intended for professional, industrial-process, industrial-manufacturing and educational use is covered by this part. It includes equipment and computing devices for

- measurement and test;
- control;
- LABORATORY use;
- accessories intended for use with the above (such as sample handling equipment),

intended to be used in industrial and non-industrial locations.

Computing devices and assemblies and similar equipment within the scope of information technology equipment (ITE) and complying with applicable ITE EMC standards can be used in systems within the scope of this part of IEC 61326 without additional testing, if they are suitable for the intended electromagnetic environment.

It is generally considered that this product family standard takes precedence over the corresponding generic EMC standards.

The following equipment is covered by this document.

a) Electrical measurement and test equipment

This is equipment which, by electrical means, measures, indicates or records one or more electrical or non-electrical quantities, also non-measuring equipment such as signal generators, measurement standards, power supplies and transducers.

b) Electrical control equipment

This is equipment which controls one or more output quantities to specific values, with each value determined by manual settings, by local or remote programming, or by one or more input variables. This includes industrial process measurement and control (IPMC) equipment, which consists of devices such as:

- process controllers and regulators;
- programmable controllers;
- power supply units for equipment and systems (centralized or dedicated);
- analogue/digital indicators and recorders;
- process instrumentation;
- transducers, positioners, intelligent actuators, etc.

c) Electrical LABORATORY equipment, including In Vitro Diagnostic (IVD) medical equipment

This is equipment used to prepare or analyse materials, or measure, indicate or monitor physical quantities. This equipment might also be used in areas other than laboratories.

- d) Equipment a), b) or c) as above when being equipped with components having radio functionality, for example for wireless communication.

Equipment within the scope of this document might be operated in different electromagnetic environments; depending on the electromagnetic environment different emission and immunity test requirements are applicable.

This document considers three types of electromagnetic environments:

- BASIC ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT;
- INDUSTRIAL ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT;
- CONTROLLED ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT.

Corresponding immunity test requirements are described in Clause 6.

In terms of emission requirements, equipment shall be classified in Class A or Class B equipment, as per the requirements and procedure of CISPR 11. The corresponding emission requirements are described in Clause 7.

The specified emission and immunity requirements aim at achieving electromagnetic compatibility between equipment covered in this document and other equipment that might operate at locations with electromagnetic environments considered in this document. Guidance for an assessment concerning the risk for achieving EMC is given in Annex B.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-161:1990, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 161: Electromagnetic compatibility*
 IEC 60050-161:1990/AMD1:1997
 IEC 60050-161:1990/AMD2:1998
 IEC 60050-161:1990/AMD3:2014
 IEC 60050-161:1990/AMD4:2014
 IEC 60050-161:1990/AMD5:2015
 IEC 60050-161:1990/AMD6:2016
 IEC 60050-161:1990/AMD7:2017
 IEC 60050-161:1990/AMD8:2018
 (available at <<http://www.electropedia.org>>)

IEC 61000-3-2:2018, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)*

IEC 61000-3-3:2013, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection*
 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017

IEC 61000-3-11:2017, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-11: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems – Equipment with rated current ≤75 A and subject to conditional connection*

IEC 61000-3-12:2011, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-12: Limits – Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 A and ≤75 A per phase*

IEC 61000-4-2:2008, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test*

IEC 61000-4-3:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test*

IEC 61000-4-3:2006/AMD1:2007

IEC 61000-4-3:2006/AMD2:2010

IEC 61000-4-4:2012, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test*

IEC 61000-4-5:2014, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test*

IEC 61000-4-5:2014/AMD1:2017

IEC 61000-4-6:2013, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields*

IEC 61000-4-8:2009, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test*

IEC 61000-4-11:2020, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase*

CISPR 11:2015, *Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement*

CISPR 11:2015/AMD1:2016

CISPR 11:2015/AMD2:2019

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	28
INTRODUCTION	30
1 Domaine d'application	31
2 Références normatives	32
3 Termes, définitions et abréviations	33
3.1 Termes et définitions	33
3.2 Abréviations	36
4 Généralités	36
5 Plan d'essai de CEM	37
5.1 Généralités	37
5.2 Configuration de l'EST lors des essais	37
5.2.1 Généralités	37
5.2.2 Composition de l'EST	37
5.2.3 Assemblage de l'EST	37
5.2.4 ACCES d'entrée/sortie	38
5.2.5 MATERIEL AUXILIAIRE	38
5.2.6 Câblage et mise à la terre	38
5.3 Conditions de fonctionnement de l'EST lors des essais	38
5.3.1 Modes de fonctionnement	38
5.3.2 Conditions d'environnement	38
5.3.3 Logiciel de l'EST durant l'essai	38
5.4 Spécification des PERFORMANCES FONCTIONNELLES	38
5.5 Description d'essai	38
6 Exigences relatives à l'immunité	39
6.1 Conditions lors des essais	39
6.2 Exigences pour les essais d'immunité	39
6.3 Aspects aléatoires	42
6.4 Critères de performance	43
6.4.1 Généralités	43
6.4.2 Critère de performance A	43
6.4.3 Critère de performance B	43
6.4.4 Critère de performance C	43
7 Exigences relatives à l'émission	44
7.1 Conditions durant les mesurages	44
7.2 Limites d'émission	44
8 Résultats d'essai et rapport d'essai	44
9 Instructions pour l'utilisation	45
Annexe A (normative) Exigences concernant les essais d'immunité pour le MATERIEL D'ESSAI ET DE MESURE PORTABLE alimenté par batterie ou par le circuit mesuré	46
Annexe B (informative) Guide d'analyse et d'appréciation du risque dans le cadre de la compatibilité électromagnétique	47
B.1 Généralités	47
B.2 Analyse du risque	47
B.3 Appréciation du risque	47
Bibliographie	49

Figure 1 – Exemples d'accès	35
Tableau 1 – Exigences d'essai relatives à l'immunité des matériels utilisés en ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE ORDINAIRE	40
Tableau 2 – Exigences d'essai relatives à l'immunité des matériels utilisés en ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE INDUSTRIEL	41
Tableau 3 – Exigences d'essai relatives à l'immunité des matériels utilisés en ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE CONTROLE	42
Tableau A.1 – Exigences concernant les essais d'immunité pour le MATERIEL D'ESSAI ET DE MESURE PORTABLE	46

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE – EXIGENCES RELATIVES À LA CEM –

Partie 1: Exigences générales

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61326-1 a été établie par le sous-comité 65A: Aspects systèmes, du comité d'études 65 de l'IEC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2012. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- les niveaux d'essai d'immunité et les critères de performance ont été revus;
- les exigences concernant le matériel d'essai et de mesure portable ont été clarifiées et modifiées;
- la description des environnements électromagnétiques a été améliorée.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
65A/975/FDIS	65A/985/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Dans le présent document, les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- Termes définis à l'Article 3 et utilisés dans tout ce document: PETITES MAJUSCULES

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61326, publiées sous le titre général *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

INTRODUCTION

Les instruments et matériels relevant du domaine d'application du présent document peuvent souvent être très dispersés géographiquement et fonctionnent donc dans un large éventail de conditions environnementales.

La limitation des émissions électromagnétiques indésirables permet d'éviter qu'un autre matériel, installé à proximité, soit soumis à l'influence du matériel à l'étude. Les limites sont plus ou moins spécifiées dans les publications de l'IEC et du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR) et proviennent donc de ces documents.

Toutefois, il convient que le matériel fonctionne sans dégradation excessive dans un environnement électromagnétique type pour les sites d'utilisation prévus. À cet effet, le document spécifie trois types différents d'environnements électromagnétiques ainsi que les niveaux d'immunité. L'IEC TR 61000-2-5 donne des informations plus détaillées en ce qui concerne les problèmes associés aux environnements électromagnétiques. Les risques particuliers, dus par exemple à des coups de foudre proches ou directs, à l'ouverture d'un circuit ou à un rayonnement électromagnétique exceptionnellement élevé à proximité immédiate, ne sont pas couverts.

Il convient que les systèmes électriques et/ou électroniques complexes exigent tout au long de leur conception et de leur installation une planification de la CEM prenant en compte l'environnement électromagnétique, les exigences particulières et la gravité des défauts.

Cette partie de l'IEC 61326 spécifie les exigences relatives à la CEM qui sont généralement applicables à tout matériel relevant de son domaine d'application. Pour certains types de matériels, ces exigences sont complétées ou modifiées par les exigences particulières d'une ou plusieurs des parties de l'IEC 61326-2 (toutes les parties). Il convient de lire celles-ci conjointement avec les exigences de l'IEC 61326-1.

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE – EXIGENCES RELATIVES À LA CEM –

Partie 1: Exigences générales

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61326 spécifie les exigences relatives à l'immunité et aux émissions concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) pour les matériels électriques fonctionnant à partir d'une source d'alimentation ou d'une batterie inférieure à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu ou à partir du circuit mesuré. Elle concerne les matériels prévus pour un usage professionnel, pour les processus industriels et pour l'enseignement. Cela comprend les matériels et les dispositifs informatiques pour

- le mesurage et les essais;
- la commande;
- les applications en LABORATOIRE;
- les accessoires prévus pour être utilisés dans les cas susmentionnés (par exemple, matériel de manipulation d'échantillons),

dans un usage en milieu industriel ou non industriel.

Les dispositifs informatiques et les matériels similaires relevant du domaine d'application des appareils de traitement de l'information (ATI) et répondant aux normes de CEM des ATI peuvent être utilisés dans les systèmes relevant du domaine d'application de la présente partie de l'IEC 61326, sans essais supplémentaires s'ils sont adaptés à l'environnement électromagnétique prévu.

En règle générale, la présente norme de famille de produits prévaut sur les normes CEM génériques correspondantes.

Les matériels cités ci-après sont traités dans le présent document.

a) Matériels électriques de mesure et d'essai

Matériels électriques permettant de mesurer, d'indiquer ou d'enregistrer une ou plusieurs grandeurs électriques ou non électriques, et également des matériels qui ne sont pas des matériels de mesure, tels que générateurs de signaux, étalons, alimentations et transducteurs.

b) Matériels électriques de commande

Matériels servant à commander une ou plusieurs grandeurs de sortie spécifiques, chacune de ces grandeurs étant déterminée par des réglages manuels, par une programmation locale ou à distance, ou par une ou plusieurs variables d'entrée. Cette catégorie comprend les matériels de mesure et de commande dans les processus industriels (IPMC - industrial process measurement and control), tels que:

- les régulateurs et contrôleurs de processus;
- les automates programmables;
- les blocs d'alimentation des matériels et des systèmes (centralisés ou spécialisés);
- les indicateurs et les enregistreurs analogiques/numériques;
- les instruments de processus;
- les transducteurs, positionneurs, organes de commande intelligents, etc.

- c) Matériels électriques de LABORATOIRE, y compris le matériel médical de diagnostic in vitro (IVD – In Vitro Diagnostic)

Ces matériels servent à préparer ou analyser des matières, ou à mesurer, indiquer ou contrôler les grandeurs physiques. Ces matériels peuvent être aussi utilisés dans des emplacements autres que des laboratoires.

- d) Matériels a), b) ou c) ci-dessus équipés de composants ayant une fonction radioélectrique, par exemple pour les communications sans fil.

Les matériels relevant du domaine d'application du présent document peuvent être utilisés dans des environnements électromagnétiques différents; selon l'environnement électromagnétique, différentes exigences concernant les émissions et les essais d'immunité sont applicables.

Le présent document prend en considération trois types d'environnements électromagnétiques:

- l'ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE ORDINAIRE;
- l'ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE INDUSTRIEL;
- l'ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE CONTROLE.

Les exigences correspondantes relatives aux essais d'immunité sont décrites à l'Article 6.

En matière d'exigences relatives aux émissions, les matériels doivent être classés en matériels de classe A ou de classe B, conformément aux exigences et à la procédure de la CISPR 11. Les exigences correspondantes relatives aux émissions sont décrites à l'Article 7.

Les exigences spécifiées relatives aux émissions et à l'immunité ont pour objet d'assurer la compatibilité électromagnétique entre le matériel couvert par le présent document et d'autres matériels susceptible de fonctionner dans des environnements électromagnétiques pris en considération dans le présent document. L'Annexe B donne des recommandations pour une appréciation du risque relatif à l'obtention de la CEM.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60050-161:1990, *Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) – Partie 161: Compatibilité électromagnétique*

IEC 60050-161:1990/AMD1:1997

IEC 60050-161:1990/AMD2:1998

IEC 60050-161:1990/AMD3:2014

IEC 60050-161:1990/AMD4:2014

IEC 60050-161:1990/AMD5:2015

IEC 60050-161:1990/AMD6:2016

IEC 60050-161:1990/AMD7:2017

IEC 60050-161:1990/AMD8:2018

(disponible à l'adresse < <http://www.electropedia.org>>)

IEC 61000-3-2:2018, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2: Limites – Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils ≤16 A par phase)*

IEC 61000-3-3:2013, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3: Limites – Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné ≤ 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel*
IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017

IEC 61000-3-11:2017, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-11: Limites – Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension – Équipements ayant un courant assigné ≤ 75 A et soumis à un raccordement conditionnel*

IEC 61000-3-12:2011, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-12: Limites – Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et ≤ 75 A par phase*

IEC 61000-4-2:2008, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques*

IEC 61000-4-3:2006, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques*
IEC 61000-4-3:2006/AMD1:2007
IEC 61000-4-3:2006/AMD2:2010

IEC 61000-4-4:2012, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en sèves*

IEC 61000-4-5:2014, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc*
IEC 61000-4-5:2014/AMD1:2017

IEC 61000-4-6:2013, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure – Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques*

IEC 61000-4-8:2009, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-8: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau*

IEC 61000-4-11:2020, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-11: Techniques d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension pour les appareils à courant d'entrée inférieur ou égal à 16 A par phase*

CISPR 11:2015, *Appareils industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques de perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure*
CISPR 11:2015/AMD1:2016
CISPR 11:2015/AMD2:2019